

Monitoreo y control estadístico de atributos en procesos con alta tasa de producción y bajo número de defectos : aplicación a un caso real de planta.

Von Fürth, Patricia Alejandra Carolina (2013) *Monitoreo y control estadístico de atributos en procesos con alta tasa de producción y bajo número de defectos : aplicación a un caso real de planta.* [Tesis de maestría]

El texto completo no está disponible en este repositorio.

Resumen

Los procesos de alta calidad se basan en una baja tasa de productos no conformes. Tradicionalmente el monitoreo de los procesos se realiza a través de los gráficos tradicionales de Shewhart (3-sigma), basados en la aproximación normal. Pero este tipo de gráfico no es exacto cuando la tasa de defectos p es muy pequeña. En la presente tesis se realiza una comparación entre los gráficos tradicionales de Shewhart con otros tipos basados en la corrección de los límites de control y con otros basados en la suma acumulada de conformidades que se miden en partes por millón (ppm). Estos gráficos para procesos de alta calidad tienen la ventaja de ser más sensibles ante la tasa de defectos de baja.

Tipología documental: Tesis de maestría

Descriptor: [Q Ciencia > QD Química](#)
[T Tecnología > TALIM Tecnología de los Alimentos](#)

Unidad Académica: [Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Químicas](#)